

EINLADUNG zum Seminar:

„Optische und elektrische Messung dünner Schichten“

am Dienstag, den 10. Mai 2011

Veranstaltungsort: Hotel Novotel Leipzig City, Goethestraße 11, 04109 Leipzig

Sehr geehrte Damen und Herren,

SENTECH veranstaltet ein SEMINAR zum Thema:

„Optische und elektrische Messung dünner Schichten“

Im Seminar „Optische und elektrische Messung dünner Schichten“ stellen wir die ganze Breite der optischen Messtechnik zur Charakterisierung dünner Schichten mit Ellipsometrie und Reflektions-Transmissions-Spektroskopie dar.

Dabei stehen aktuelle Themen, wie die Qualitätskontrolle dünner Schichten in der Photovoltaik und die Nanotechnologie-Schichten im Vordergrund.

Ladungsträger Lebensdauer Messungen spielen eine zentrale Rolle in der Qualitätskontrolle von PV Silizium. Wir stellen Ihnen sowohl die MDP-Methode als auch ein umfassendes Geräteprogramm vor.

Darüber hinaus informieren wir Sie über neue Geräteentwicklungen wie die SGME-Ellipsometrie.

Wir freuen uns, dass wir Ihnen ein attraktives Programm bieten können. Referenten von Freiberg Instruments und SENTECH werden Ihnen die Messmethoden zur Qualitätssicherung präsentieren.

Bitte melden Sie sich umgehend zum Seminar „Optische und elektrische Messung dünner Schichten“ an.

Die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt.

Das Seminarprogramm und das Anmeldeformular sind angehängt. *Bitte faxen Sie uns Ihre Anmeldung umgehend zu.*

In aller Regel können wir Ihnen die Seminarvorträge auf CD zur Verfügung stellen.

Auskunft über das Seminar erhalten Sie unter der Telefonnummer: 089 – 897 96070.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in LEIPZIG und verbleiben
mit freundlichen Grüßen

Ihr **SENTECH** Team

SEMINAR:
Optische und elektrische Messung dünner
Schichten

am Dienstag, den 10. Mai 2011
in Leipzig
Veranstaltungsort: Hotel Novotel Leipzig City
Goethestraße 11, 04109 Leipzig
Tel.: +49 (0) 341-99580

Seminarprogramm

- 9.00 Begrüßung**
H. Witek, SENTECH GmbH
- 9.10 Ellipsometrie und Reflektions-Transmissions-Spektroskopie zur Charakterisierung dünner Schichten**
Uwe Richter, SENTECH Instruments GmbH, Berlin
- 10.00 Spektroskopische Ellipsometrie an Graphen Schichten**
Lars Reißmann, SENTECH Instruments GmbH, Berlin
- 10.45 Kaffeepause und Diskussion**
- 11.00 Inline Messung von TCO und Absorberschichten in der Fertigung von Dünnschicht Solarzellen**
Bernd Gruska, SENTECH Instruments GmbH, Berlin
- 11.30 SenSol H zur offline Messung von Haze, Schichtwiderstand, Schichtdicke und Dispersion von TCO und Absorber Schichten auf Glas**
Georg Dittmar, SENTECH Instruments GmbH, Berlin
- 12.00 Mittagspause und Diskussion**
- 13.00 Inline und offline Charakterisierung von AR- und Passivierungsschichten auf texturierten mono- und multikristallinem Si mit Ellipsometrie**
Sven Peters, SENTECH Instruments GmbH, Berlin
- 13.30 MDP Ladungsträger Lebensdauer Mapping von multikristallinen Blöcken**
Nadine Schüler, Freiberg Instruments GmbH, Freiberg
- 14.00 Inline on the fly Ladungsträger Lebensdauer Mapping von PV Si Wafern**
Kay Dornich, Freiberg Instruments GmbH, Freiberg
- 14.30 Kaffeepause und Diskussion**
- 14.45 SGME SENresearch, das weltweit erste magnetooptische spektroskopische Ellipsometer**
Helge Ketelsen, SENTECH Instruments, Berlin
- 15.15 Spektroskopische Ellipsometrie im mittleren Infrarot mit dem SENDIRA, Messung von Dotierprofilen**
Georg Dittmar, SENTECH Instruments, Berlin
- 15.45 SENpro, ein hochgenaues, kostengünstiges spektroskopisches Ellipsometer**
Stefan Brunn, SENTECH Instruments, Berlin
- 16.15 Vorführungen von**
- spektroskopischen Ellipsometern: SENpro, RM 1000, SENreserch UV/VIS PV
 - Ladungsträger Lebensdauer Messgeräte: MDPingot , MDPspot , MDPmap
- 17.00 ENDE der Veranstaltung**



Erfolg
durch Leistung

SENTECH
Gesellschaft für Sensortechnik mbH

Konrad-Zuse-Bogen 13
D-82152 Krailling, Germany
Telefon: +49/89/ 897 9607 - 0
Fax: +49/89/ 897 9607 - 22
E-Mail: sales@sentech.de
Website: www.sentech-sales.de

Bitte faxen Sie diese Anmeldung an
SENTECH
Fax Nr. 089 8979607 22

Titel:	Vorname:	Nachname:
Firma:		
Abteilung:		
Straße:	PLZ/Ort:	
Telefon-Nr.:	Fax-Nr.:	
E-Mail:		

SEMINARANMELDUNG

<input type="checkbox"/>	Ja, ich melde mich verbindlich zum SEMINAR „Optische und elektrische Messung dünner Schichten“ in Leipzig am 10. Mai 2011 an.
..... Ort, Datum Unterschrift